



纳米结构持久性有毒物质检测方法及器件

文献类型：专利

作者 毛庆和¹

发表日期 2008

专利国别 中国

专利号 101281134

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-18

申请日期 2008

专利申请号 200810100564.7

源URL [\[http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9988\]](http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9988)

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 毛庆和. 纳米结构持久性有毒物质检测方法及器件, 纳米结构持久性有毒物质检测方法及器件, 纳米结构持久性有毒

GB/T 7714 物质检测方法及器件, 纳米结构持久性有毒物质检测方法及器件, 纳米结构持久性有毒物质检测方法及器件, 纳米结构持久性有毒物质检测方法及器件, 纳米结构持久性有毒物质检测方法及器件, 纳米结构持久性有毒物质检测方法及器件. 101281134. 2008-01-01.

入库方式：OAI收割

来源：[合肥物质科学研究院](#)

浏览

199

下载

72

收藏

0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

